**ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СУБОКСИДОВ SI(111)**

Н. Ж. Одилова

*Каршинский государственный университет, Карши, 180117 Узбекистан \*е-mail:* *ezoza1408@mail.ru*

На рис представлена рентгенограмма монокристаллического кремния марки КДБ-20. Из рис. видно, что в рентгненограмме наблюдается селективных структурных линии с различной по величиной интенсивностью [1-2].



Рис. Рентгенограмма монокристаллического кремния марки КДБ-20

Так, в работе было показано, что в некоторых выращенных кристаллах содержание кислорода в различных преципитатах может достигать 20 % от общей концентрации кислорода.

Список литературы

1. Рейви. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии. // Под ред. С. Н. Горина, пер. с англ. –М.: Мир, 1984. – 475 с.
2. М.Ю. Ташметов, М.Каланов,. Медь кислородные нанокристаллиты в монокристаллах кремния, легированных медью // Узбекский физический журнал. –Ташкент, 2018, –Т.20, №2, с. 90-97.